



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

«Передовые решения для изучения поверхности и поверхностных структур материалов»

19 мая 2016

Время	Тема	Докладчик/должность
09:30 – 09:45	Открытие семинара: приветственное слово	Лапин Андрей Руководитель отдела научного и промышленного материаловедения (ОПТЭК)
09:45 – 10:25	Объединенные методы в сканирующей электронной микроскопии	Нуждин Евгений Эксперт департамента научного и промышленного материаловедения (ОПТЭК)
10:25 – 10:55	Оптическая профилометрия Bruker: превосходя дифракционный предел	Фокин Денис Эксперт отдела метрологии поверхности (ОПТЭК)
10:55 – 11:15	Кофе-брейк	
11:15 – 11:55	Конфокальная микроскопия Zeiss: неразрушающий анализ поверхности исследуемых материалов	Баринов Андрей Ведущий эксперт по лазерной сканирующей микроскопии (ОПТЭК)
11:55 – 12:30	Гелий-ионная микроскопия – технология будущего	Нуждин Евгений Эксперт департамента научного и промышленного материаловедения (ОПТЭК)
12:30 – 13:00	Атомно-силовая микроскопия Bruker: неразрушающий анализ механических и электрических свойств поверхности	Фокин Денис Эксперт отдела метрологии поверхности (ОПТЭК)
13:00	Вручение сертификатов зарегистрированным участникам	



**Место проведения: ул. Герцена 2, Инновационно-технологический
бизнес-инкубатор ТГУ, 3 ауд. (3 этаж)**

Ссылка для регистрации: <http://qoo.by/khH>

**Контакты: Аронова Юлия – менеджер ТРЦКП
Тел. 783-714, e-mail: ckp@mail.tsu.ru**